

Mire de Résolution de Microscopie Haute Résolution



High Resolution Microscopy Resolution Target, #37-539

Stock **#37-539** **2 In Stock**

-

1

+

€1.880⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€1.880,00 prix unitaire
Qté 5+	€1.786,30 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
10 x 10 x 1

Construction:
Stainless Steel, 75 x 25 x 1.5mm, microscope slide format

Motif:
Pinholes Diameter: 4µm, 2µm, 1µm, 0.5µm, 0.25µm
Line patterns: 58 groups, 7.5 - 3300 lp/mm
Line Widths: 66.7µm - 0.152µm

100nm/cm = 10 ⁻⁵	Tolérance de Motifs:
Propriétés optiques	
Fused Silica w/Chrome deposit	Substrat: 
OD>7 @ 400nm, 6 @ 550nm, 4.5 @ 750nm, 3.6 @ 1000nm	Densité Optique OD:
200 - 2000nm	Gamme Spectrale:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 233:

Description produit

- Petits motifs - 100 nm et 3300 lp/mm
- Fabriquées par lithographie à faisceau d'électrons haute précision
- Modèles négatifs

Les Mires pour la Microscopie Haute Résolution ont été conçues grâce à la méthode de lithographie par faisceau d'électrons haute précision. Les motifs sont gravés sur un substrat en silice fondue de 10 × 10 mm² à large transmission spectrale (DUV-VIS-NIR), sur lequel est appliquée une couche de chrome à haute densité optique. En retirant la couche de chrome, les motifs peuvent atteindre 100 nm. Ces mires fournissent une excellente stabilité dimensionnelle et sont montées sur un porte-lame de microscope en métal. Les motifs négatifs des mires permettent aux structures d'être transparentes, tandis que l'arrière-plan est bloqué par une couche de chrome.

Mire USAF pour la Microscopie Haute Rés.

Les Mires USAF pour la Mcroscopie Haute Rés. déterminent facilement la limite de résolution d'un objectif et sont constituées de 59 motifs linéaires avec 7,5 à 3300 lp/mm en alignement horizontal et vertical. Ce type de mire présente également 5 sténopés ayant des diamètres de 4,0 à 0,25 µm, ce qui permet d'apporter une description détaillée de l'optique de micro-imagerie.

Mire Étoilée pour la Microscopie Haute Rés.

Les Mires Étoilées pour la Microscopie HaK14ute Rés. sont constituées de 5 étoiles de Siemens. Ces mires ont une particularité ; le centre des étoiles est fabriqué avec précision pour atteindre une largeur minimale de 150 nm. Les mires étoilées sont parfaites pour déterminer la résolution des objectifs de microscope avec des ouvertures numériques très élevées.

Mire Damier pour la Microscopie Haute Rés.

La Mire Damier pour la Mcroscopie Haute Rés. présente une dimension totale de 9,0 x 9,0 mm², avec des carrés de 50 x 50 µm². Le damier est idéal pour tester l'inclinaison et la distorsion de l'image, et également pour déterminer la qualité d'image en raison de ses bords droits et nets.

High Res Microscopy USAF Target

High Res Microscopy USAF Targets easily determine the resolution limit of an objective in transmitted light and consists of 59 line patterns with 7.5 to 3300 lp/mm in horizontal and vertical alignment. This target also features 5 pinholes with diameters between 4.0-0.25µm, which allows for detailed characterization of micro-imaging optics.

High Res Microscopy Star Target

High Res Microscopy Star Targets consist of 5 Siemens stars and show the peculiarity that the tapered segments in the center of the stars are precisely manufactured to a minimum width of 150nm. This target is ideal for the determining the resolution of microscope objectives with very high numerical apertures.

High Res Microscopy Checker Board

High Res Microscopy Checker Board features a total size of 9.0 x 9.0mm² out of 50 x 50µm² squares. The checker board is ideal for testing of image skew and curvature, along with determining image quality due to the straight and sharp edges.